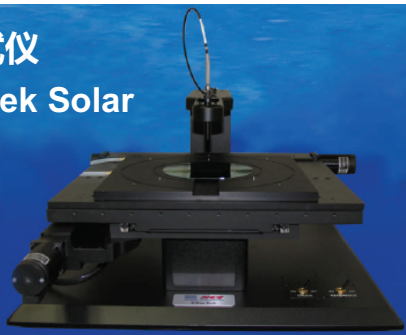


# 美国SCI全新技术太阳能电池片 多层膜厚测试仪及全反射率测试仪

多层膜厚测试仪  
Model FilmTek Solar



FilmTek Solar 技术规格

量测范围:	3nm-150 $\mu$ m
量测精度:	$\pm 2\text{\AA}$ for NIST traceable standard oxide 1000 $\text{\AA}$ to 1 $\mu$ m
光谱范围:	240nm-950nm
测量光斑大小:	1mm
可支持样品尺寸:	2mm to 156mm
光谱精度:	0.3nm
光源:	氙灯或卤素灯 (寿命保证至少2,000 小时)
反射重复性(在600nm时) :	0.01%
量测时间:	<1秒/点
数据采集时间:	0.2 秒

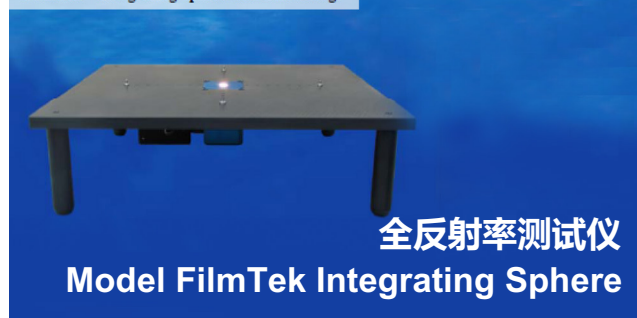
**应用：** 测量太阳能电池正面PECVD后的多层防反膜厚度以及针对PERC电池背面多层结构薄膜厚度。

- 特点：**
- 1) 宽达25°的收光角度,去掉繁琐的样品对准步骤,可直接测试制绒表面,另可配备自动mapping测试平台
  - 2) 波长范围宽,覆盖近紫外+可见光+近红外,特别适合测试太阳能钝化防反膜
  - 3) 大范围厚度测试能力3nm-150 $\mu$ m
  - 4) 仅1mm聚焦点+大角度收光,特有信噪比提升技术,确保测试数据准确可靠
  - 5) 同时得到多层膜厚,反射率,折射率和消光系数
  - 6) 单点测试速度快, 仅需不到1s时间

FilmTek™ Integrating Sphere技术规格

量测范围:	10nm-50 $\mu$ m
量测精度:	$\pm 2\text{\AA}$ for NIST traceable standard oxide 1000 $\text{\AA}$ to 1 $\mu$ m
光谱范围:	380nm-950nm
测量光斑大小:	10.3mm
可支持样品尺寸:	15mm to 300mm
光谱精度:	0.3nm
光源:	钨卤素灯 (寿命保证至少900 小时)
反射重复性(在600nm时) :	0.01%
量测时间:	<1秒/点
数据采集时间:	0.2 秒

FilmTek™ Integrating Sphere with Fixed Stage



全反射率测试仪

Model FilmTek Integrating Sphere

**应用：** 可进行全反射率,漫反射和镜面反射测试, 适合监控电池表面制绒, PECVD镀膜工艺品质。

- 特点：**
- 1) 宽达10.3mm的光照孔,内置积分球提供180°的均匀照度,可全光反射率测试
  - 2) 内置切换开关,可测试漫反射和镜面反射率
  - 3) 可针对制绒后, PEVCD镀膜后的反射率量测

